

RoHS指令対応の分析はおまかせください

基板の有害物質マッピング分析

詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/RoHS.html

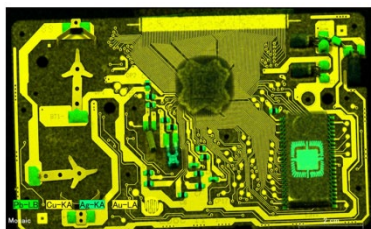
概要 RoHS指令における有害物質分析は、均質物質ごとに確認する必要があり、部品ごとにその有害物質含有量を測定するには多くの時間と分析労力を費やすことになります。そこで、基板全体の構成元素の分布状況を画像データとして得ることができる、蛍光X線による元素マッピング分析が非常に有効です。これにより、製品のロット管理や抜き打ち検査が簡易的に可能です。

特長

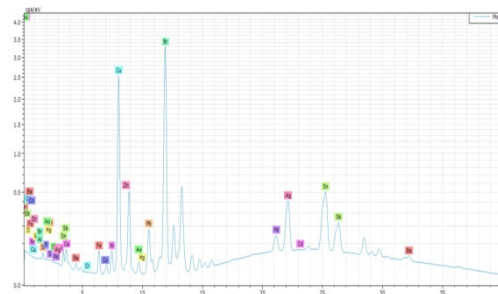
- 部品個別に有害物質含有量を確認せずに、基板全体での判定が可能
- 任意の場所をポイント分析を行うことで閾値を満足することの確認が可能



蛍光X線分析装置 (EDX)

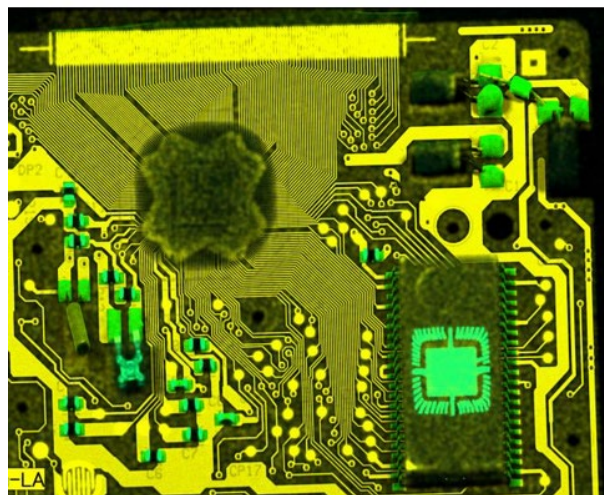
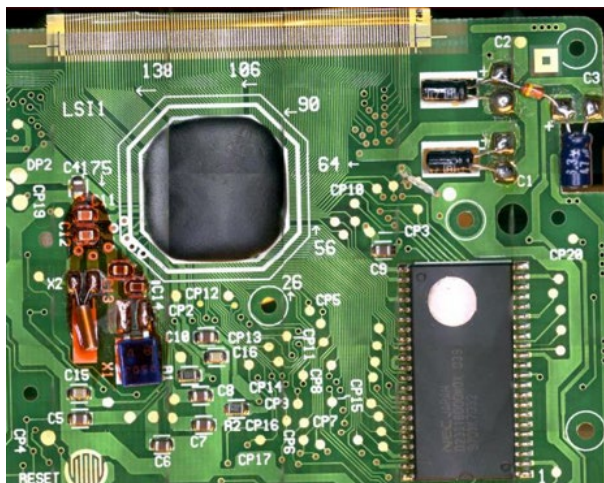


元素マッピング
(緑：Pbの存在確認)



スポット分析で閾値判定

蛍光X線マッピング分析例



Pbの付着箇所が、実装半田部分、コネクタ端子部分、チップ抵抗部分に明確に把握する事ができます。確認後、濃度の把握はポイント分析を合わせて行うことで閾値の判定が可能です。